第二章

利用多面體矽氧烷插層黏土提升聚苯乙烯奈米複合材料之熱性質

2.1 摘要

我們使用乳化聚合的方法製備聚苯乙烯/黏土奈米複合材料,奈 米複合材料在 3wt%的黏土含量下達到脫層結構。我們使用兩種不同 的插層劑改質黏土: POSS (Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane)與 CPC (Cetylpyridinium chloride)。插層劑預先插層到分散於水中的黏 土後再進行乳化聚合反應,雖然 POSS 插層後黏土的層間距離較 CPC 插層後的層間距離小,但聚苯乙烯與 POSS 互容性較佳,所以易使黏 土達到脫層結構,而CPC則反之。紅外線光譜儀分析進一步確認POSS 111111 成功插層進入黏土層間,X 光繞射儀(XRD)與穿透式電子顯微鏡 (TEM) 觀察黏土在高分子基材中分散的程度, POSS 改質黏土之奈 米複合材料達到脫層結構 (exfoliated), CPC 改質黏土之奈米複合材 料達到插層結構(intercalated)。在相同的聚合條件下奈米複合材料之 聚苯乙烯分子量較純的聚苯乙烯分子量小,有添加黏土的聚苯乙烯之 玻璃轉移溫度(T_g)較純的聚苯乙烯高8℃且熱裂解溫度高21℃。POSS 分子的存在於黏土中增加其高分子的的熱穩定性。

2.2 简介

黏土填充高分子系統預期改善其高分子基材 (polymer matrix) 許多性質的角色。在近年的文獻中,黏土填充高分子系統扮演改善其 抗張強度、熱性質¹⁻⁹、熱變形溫度¹⁻⁶、阻燃性¹²、減低小分子滲透^{5,} ^{10.11}與溶劑的腐蝕性¹³等被廣泛的研究。

典型的奈米複合材料包含有機改質黏土與高分子基材 (Polymer matrix)。蒙托土 (MMT) 為層狀矽酸鹽結構,層與層間靠凡得瓦爾 力及金屬離子的離子鍵緊緊結合在一起。介於層間的距離如同黏土的 通道。改質無機黏土使得黏土與有機的高分子相容,其層間的陽離子 Na⁺金屬與有機胺鹽或磷酸鹽進行陽離子交換,使得親水性黏土轉變 為疏水性黏土。奈米複合材料使用混摻 (融熔混摻或溶液混摻)或原 位聚合法製備而成。

在此篇文章中,我們製備 CPC 改質黏土與 POSS 改質黏土的奈 米複合材料(圖示1)。在本實驗室使用 CPC 改質黏土製備成聚苯乙 烯奈米複合材料其熱性質沒有明顯改善¹⁴⁻¹⁸。典型的 POSS 分子其熱 裂解溫度高達 300℃,熱裂解溫度比其他的有機分子高。POSS 的組 成為堅硬六面體結構,其側鏈長度為 0.53nm 本身結構為奈米尺寸, 有八隻官能基可以進行插層黏土。POSS 的衍生物:四級胺鹽的官能 基扮演改質黏土的重要角色;並進一步提高其奈米複合材料的熱性

17

質。

聚苯乙烯/黏土奈米複合材料藉由懸浮插層劑改質黏土與苯乙烯 單體進行乳化聚合製備而成,紅外線光譜儀分析確認其 POSS 分子成 功插入黏土中。X 光繞射儀與穿透式電子顯微鏡描述其黏土的層間距 離與分散程度,聚苯乙稀/黏土奈米複合材料藉由微差熱掃描卡計與 熱重量分析儀描述其熱性質。

2.3 實驗

2.3.1 實驗藥品

1. 苯乙烯 (Styrene)

來源: Aldrich Chemical

化學結構:





- 2. 丙酮 (Acetone)
 - 來源: Aldrich Chemical

化學結構:



3. 甲醇 (Methanol)

來源:Aldrich Chemical

化學結構:CH₃OH

4. Cetylpyridinium chloride (CPC)

來源: Acros Organics, USA

化學結構:



- 5. Aminopropylisobutyl polyhedral oligomer silsesquioxane (POSS)
 - 來源:Hybrid Plastics

化學結構:



6. Sodium dodecyl sulfate (SDS)

來源: Curtin Matheson Scientific

化學結構:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na

7. Hydrochloride acid (HCl)

來源: Curtin Matheson Scientific

化學結構:HCl

8. Potassium persulfate $(K_2S_2O_8)$

來源: Fisher Scientific Co.,

化學結構:K₂S₂O₈

9. Tetrahydrofuran (THF)

來源:Aldrich Chemical 化學結構:



- 10. Aluminum sulfate $(Al_2 (SO_4)_3)$
 - 來源: Fisher Scientific Co.

化學結構: Al₂ (SO₄)₃

11.Potassium hydroxide (KOH)

來源:Aldrich Chemical

化學結構:KOH

12.蒙托土 (Na-MMT)

來源:Telekal

2.3.2 製備 CPC 改質之黏土

有機改質蒙托土包括 5g 的鈉-黏土分別與 1g、 1.5g、 2g 與 2.5g 的 CPC 進行插層。

2.3.3 製備 POSS 改質之黏土

- 取預洗過的黏土 1g 與去離子水 50ml 置於 100ml 的雙頸圓底燒瓶
 中,在室溫下連續攪拌 4 小時。
- 取 0.4g 的 POSS 與 1ml THF 置於燒瓶中後加入 1ml 10%的鹽酸攪拌1小時。
- 3. 將 POSS 溶液加入黏土懸浮溶液攪拌 24 小時。
- 將上述的溶液過濾並用去離子水洗數次後在室溫下的烘箱中乾燥
 24小時。

2.3.4 製備聚苯乙烯/黏土奈米複合材料

- 取 0.3g 黏土於 40ml 的去離子水在室溫下攪拌四小時形成懸浮溶液。
- 2. 加入 0.12g 的插層劑(CPC 或 POSS)於上述溶液中再攪拌 4 小時。
- 在溶液中加入 0.02g 的 KOH 與 0.4g 的 SDS 升溫至 50℃,此時緩 慢加入苯乙烯單體 10g 與 0.05g K₂S₂O₈ 在 50℃下進行聚合 8 小時。

- 谷卻後,加入 2.5%10ml 的 Al₂ (SO₄)₃於乳化聚合的溶液中,隨 後加入 10ml 的稀鹽酸溶液並攪拌。
- 5. 加入丙酮使乳化聚合反應終止。
- 6. 將高分子用甲醇與水清洗數次並於 80℃的烘箱中乾燥 24 小時
- 7. 用相同的步驟製備聚苯乙烯。

2.4 實驗儀器

1. 傅立葉紅外線光譜儀 (FT-IR)

型號: Nicolet Avatar320 FT-IR spectrophotometer

2. X-ray 繞射儀 (X-ray diffraction pattern) 型號: M18XHF-SPA

製造廠商:MacScience Co.,Japan

3. 微差掃瞄卡計 (Different Scanning Calorimeter, DSC)

型號: Du-Pont DSC-9000

代理公司:立源興業

4. 熱重量分析儀(Thermogravimetric Analyzer, TGA)

型號: TA Instruments Thermal Analyzer

- 5. 穿透式電子顯微鏡(TEM)
 - 型號: Hitachi H-7500 Electron Microscopy

6. 超薄切片機型號:Leica Ultracut UCT Microtome

7. GPC

2.5 材料測試及原理

 傳立葉紅外線光譜儀 (Fourier Transform Infrared Spectrometer, FT-IR)

原理:利用分子振動或轉動時所需的能量和紅外線的能量相近的 原理,紅外線的吸收光譜會因不同分子或不同官能基而有的轉動 或振動能量,因此在不同的波速上會有不同的吸收,而在高分子 的研究上,紅外線光譜不但可以由官能基波峰的變化來觀察高分 子的反應情形或受熱變化,並且對於一些高分子鏈上各個分子交 互作用力的變化情形也可以做定性上的探討。

2. X-ray 繞射儀 (X-ray Diffraction, XRD)

原理:X 光的繞射原理,在1913 年W.L.Bragg 父子在晶體結構 分析實驗中,從散射 X 光的分布情形,他們認為可將散射現象視 為入射光被晶面反射。此種反射如同鏡面反射,入射角等於反射 角。某些散射角下,相鄰晶面散射之波彼此相位相同,光程差是 波長的整數倍,產生建設性干涉,見下圖。滿足這種條件的繞射, 稱之為布拉格定律(Bragg's law)。此實驗所用的為 Cu 靶,λ=1.54 A。公式如下:





晶體繞射 X-Ray 時之布拉格定律繞射

- 3. 微差掃瞄卡計(Different Scanning Calorimeter, DSC)
 - 原理:DSC 可以快速方便的研究聚合物轉移現象,其工作原理, 將參考物(一般的情況是一個空的金屬盤)和待測試樣(取極少量的 待測樣品置於另一個相同的金屬盤)保持相同的升降溫速率和相同 的溫度,由於參考物和待測物吸收能量會有不同,因此在升降溫 過程中,產生了能量的差異,可以藉由紀錄下之圖形判斷聚合物 的玻璃轉位點 Tg 和熔點 Tm。在玻璃轉移時,待測聚合物的比熱 會突然改變,DSC 圖上的基線會產生階梯式變化,可以藉由其變 化知道 Tg 和 Tm 的位置。本實驗操作條件:第一次掃描速率為 20° C/min從 30° C掃描至 200° C後極速冷卻至 30° 、第二次掃瞄速 率為 20° C/min從 30° C掃描至 200° C進行測試其比熱容(specific heat capacity, C_p)轉換曲線的中點作為玻璃轉移溫度。
- 4. 熱重量分析儀(Thermogravimetric Analyzer, , TGA)

原理:熱重分析儀基本原理將待測物置於耐高溫容器中,此容器 置於一可經由程式控制溫度的高溫爐內,待測物被置於高敏感高 精密的天秤秤台上,在加熱和冷卻的過程中,此待測物會產生重 量的變化。這個因溫度引起的重量變化可以被精密天平測出。本 實驗中取樣品約8~10mg置於耐高溫容器中,通N_{2x}流量為40ml/ min,升溫速率調整為20℃/min,由30℃加熱升溫至800℃,進行 測試。

5. 穿透式電子顯微鏡 (Transmission Electronic Microscopy, TEM) 原理:在一般的材料分析技術之中,通常無法真正直接觀察到材 料中的細微結構,因黏土片狀結構之奈米分散低於可見光之波 長,無法以傳統光學之方式觀測,而且其微小顆粒亦非一般光學 透鏡之放大倍率所能觀測的到,故需使用較可見光波長更小之電 子束,以進行觀測。其偵測方式為利用電子具有比白光更短波長 的特性,使獲得更高的解像力。其原理是利用電子槍射出電子射 線,以電磁場聚焦在打到樣品薄片上;因樣品薄片上的組成成份 並不全然相同,部份材料會使得電子四散,如無機層狀結構之黏 上;而有機之高分子材料,則電子可通過樣品而聚集,利用電磁 物鏡聚焦而成像,透過放大將電子束打在螢光幕上即可觀察以及 攝影。 6. 凝膠滲透層析儀(Gel Permeation Chromatography, GPC)(下圖) 原理:當樣品溶解於溶劑(移動相),以高壓進入管柱而滲透經過固 定相,分子流過之速度會因分子量不同而有所差別,分子量較大 之樣品分子不易受到固定基材中孔動的影響而保持其流速,而分 子量較小的樣品分子則會不斷陷入基材的孔洞之,而減緩其流 速,使得分子量不同之樣品分子能夠先後流出管柱。配合使用分 子量精準之標準品,凝膠滲透層析儀可提供準確的樣品分子量, 在高分子材料的鑑定上扮演著重要的角色。



凝膠滲透層析儀(GPC)操作流程圖

2.6 結果與討論

此篇研究著重於比較兩種不同插層劑改質黏土並製備成奈米複 合材料, CPC 插層劑其結構為一端具有四級胺鹽的官能基,另一端為 長脂肪族碳鏈。POSS 插層劑特徵為多面體結構在轉角的七個位置為 異丁基的官能基。圖示 1 表示兩種具有四級胺鹽插層劑的結構, CPC 與 POSS 用來改質黏土。傳統的插層劑,例如 CPC 插層劑在高溫下 為不穩定的。因此,我們預測具有 POSS 結構的插層劑製備成奈米複 合材料具有較佳的熱穩定性。

2.6.1 X 光繞射光譜之分析

我們使用 X 光繞射儀來觀察改質後的黏土與奈米複合材料的層 間距離,從 2θ 角度可以看出黏土通道中的層間距離的變化。圖 2-1 表示有機改質黏土在 CPC/Clay 不同比例的 X 光繞射圖,黏土的層間 距離為繞射峰位置使用布拉格方程式所計算而得的。純的黏土繞射峰 位置為 6.49°其層間距離為 1.26 nm。CPC 插層劑進入黏土的通道中 其層間距離隨著改變 CPC/Clay 的比例而增加,當 CPC/ Clay 的比例 為 0.4 時層間距離維持一定,表示插層劑在黏土的層間已經達到飽和 狀態。此結果可以明確的表示 CPC 插層劑成功插層進入黏土通道中。

圖 2-2 為 POSS 插層黏土的 X 光繞射圖。POSS 插層劑其繞射峰 位置 7.9°與 8.8°其產生的原因為 POSS 分子聚集所造成,當 POSS 插 層劑插層進入黏土的通道中其層間距離從 1.26nm 增加至 1.61nm,表 示 POSS 插層劑成功的插層進入黏土中。雖然 POSS 插層後的層間距 離較 CPC 插層後的小,但是不會影響聚苯乙烯在黏土層間的分散性。

27

POSS 與 PS 會相互作用而進一步促進黏土達到插層與脫層的結構²⁰, 在穿透式電子顯微鏡圖中表示之 POSS 改質的奈米複合材料達到完全 脫層的程度較 CPC 改質的奈米複合材料高,此結果與上述的結果相 當的一致。其 POSS /Clay 在 X 繞射圖只有一個繞射峰,沒有因為聚 集的現象而偵測到其他的繞射峰。POSS 插層的流程圖表示在圖示 2, 其層與層距離表示在圖中其由公示計算而得: △d=層間距離-一片黏 土的厚度 (~1.0nm)。以 POSS 插層劑改質黏土為例,其層間距離介 於鄰近的兩層黏土距離 (0.71nm),非常接近 POSS 分子的尺寸。其 POSS 官能基 R (異丁基) 與苯乙烯單體的凡得瓦爾作用力可以允許 苯乙烯單體能夠在黏土層間進行聚合反應。

高分子/黏土奈米複合材料的形成需要高分子插入黏土層間。有 兩種術語對奈米複合材料進行分類:插層(intercalation)與脫層 (exfoliation)。以插層為例,高分子鏈進入黏土的通道中,其層間距 離也隨之增加。換句話說,以脫層為例,黏土的層與層排列分佈為不 規則的,表示他們本身不再與陽離子作用。敘述奈米複合材料的結構 需要藉由X光繞射儀量測黏土之層間距離並且用穿透式電子顯微鏡 觀察其黏土在高分子基材間確切的分佈情形。脫層結構的形成其結構 黏土通常完全失去其規則性,用X光繞射儀所測的繞攝圖中沒有任 何的繞射峰出現。有極大的可能會出現插層與脫層的結構;此現象需 要用穿透式電子顯微鏡偵測並進一步確認。

圖 2-3 表示 CPC 改質黏土的奈米複合材料與 POSS 改質黏土的奈 米複合材料之 X 光繞射圖。CPC-與 POSS-製備的奈米複合材料在 X 光繞射圖中沒有任何的繞射峰被偵測到,所以奈米複合材料達到脫層 的結構。但仍然需要穿透式電子顯微鏡來觀察黏土真實的結構與分散 情形。由於繞射峰角度小於 3.5° 無法被 X 光繞射偵測器所接受,所 以需要穿透式電子顯微鏡輔佐。

2.6.2 穿透式電子顯微鏡對奈米複合材料型態之分析

圖 2-4 表示 CPC-與 POSS-改質之奈米複合材料的穿透式電子顯 微鏡影像。CPC 改質之奈米複合材料從圖中觀察為插層的結構。POSS 改質之奈米複合材料,每一個蒙托土層都脫離並且均勻分散於高分子 基材中,其圖表中表示為完整的脫層其結果與X 光繞射儀所測得的 數據一致。

2.6.3 紅外線光譜儀之分析

紅外線光譜儀之分析進一步確認其 POSS 插層進入黏土層間。圖 2-5 表示純的 POSS、Clay 與 POSS 改質黏土後的紅外線光譜圖。黏 土在 1040cm⁻¹ 出現一個強的吸收峰其為 Si-O-Si 鍵。POSS 插層劑的 C-H 鍵之吸收峰於 2950-2800cm⁻¹ 出現, Si-C 鍵之吸收峰於 1230cm⁻¹ 出現, POSS 結構之 Si-O-Si 鍵吸收峰於 1109cm⁻¹ 出現。POSS 改質後的黏土具有 POSS 與黏土的吸收峰,明顯的表示 POSS 插層劑成功的插層於黏土的通道中,此結果與 X 光繞射儀所測得之結果一致。

2.6.4 玻璃轉移溫度之分析

圖 2-6 表示聚苯乙烯與插層劑改質黏土奈米複合材料之微差熱掃 描卡計的溫度曲線。聚苯乙稀之玻璃轉移溫度為 100℃,其 CPC 改質 黏土與 POSS 改質黏土的奈米複合材料之玻璃轉移溫度各為 102℃與 108℃。黏土的存在具有減緩聚苯乙烯高分子鏈運動的能力,導致有 較高的玻璃轉移溫度。分散較佳之 POSS 改質黏土之奈米複合材料其 減緩高分子鏈運動的能力較 CPC 改質黏土之奈米複合材料佳。

2.6.5 奈米複合材料分子量之分析

表 2-2 所列出的純的聚苯乙烯奈米複合材料的分子量其反應條件 與乳化聚合相近。純的聚苯乙烯相較於 CPC 與 POSS 改質之奈米複 合材料具有較高的平均分子量 (Mn 與 Mw) 與較低的分子量分佈 (PDI)。之前的報導黏土扮演額外的微包的原因造成有較低的分子量 ²¹。

2.6.6 熱穩定性之分析

圖 2-7 表示純的黏土、POSS 改質後之黏土與 CPC 改質之黏土的 熱重量損失曲線,在預期中無機黏土具有特殊的熱穩定性。在高於 800°C下黏土的熱重量損失只有 5.7%符合三種在黏土中不同型態下 的結晶水造成²²。相對的,有機插層劑插層於黏土中容易被裂解,其 CPC 與 POSS 改質之黏土相較於純的黏土易於在低溫裂解。改質後的 黏土具有相同的重量組成比例 (Surfactant/Clay=0.4)在熱重量損失 5 %下表現出不同的熱裂解溫度。POSS 改質之黏土在 386°C下裂解而 CPC 改質之黏土在 278°C下裂解。其 POSS 插層之黏土相較於 CPC 插層之黏土具有較好的熱穩定性。插層後的黏土之熱重量損失是由於 熱裂解與除去的插層劑所造成,此結果與紅外線光譜儀分析一致且表 示有機的插層劑存在於黏土中。

圖 2-8 表示純的聚苯乙烯與奈米複合材料之熱重量損失曲線, POSS 與 CPC 改質之奈米複合材料相較於聚苯乙烯表現出較高的熱裂 解溫度。奈米複合材料開始的熱裂解溫度提升至較高的溫度發生, POSS 改質之奈米複合材料較 CPC 改質之奈米複合材料與純的聚苯乙 烯有較好的熱穩定性。相較於純的聚苯乙烯下的 POSS 改質之奈米複 合材料在 5%下其熱裂解溫度提升 21℃, CPC 改質之奈米複合材料提 升 18℃。表 2-1 為奈米複合材料之熱重量損失所整理之數據,POSS 改質之奈米複合材料在 50%下之熱重量損失具有較高的熱裂解溫

31

度,以 CPC 插層之奈米複合材料其 50%之熱重量損失與純的聚苯乙烯一樣。因此, CPC 改質之奈米複合材料之熱裂解溫度沒有高於純的聚苯乙烯而 POSS 改質之奈米複合材料其熱穩定性有很大的改善。

2.7 結論

我們製備聚POSS 改質黏土的聚苯乙烯奈米複合材料達到脫層的 結構,而 CPC 改質之奈米複合材料達到插層的結構。插層劑之插層 進入黏土層間由 X 光繞射

儀與紅外線光譜儀進一步的確認。X 光繞射儀所測之結果指出 POSS 插層之黏土其層間距離由 1.26nm 增加至 1.61nm,其 POSS 改質之奈 米複合材料的熱重量損失曲線相較於純的聚苯乙烯與 CPC 改質之奈 米複合材料兩者中之熱裂解溫度達到最高,表示其 POSS 改質的奈米 複合材料有較高的熱穩定性。POSS 存在於黏土中增加其純的聚苯乙 烯的熱穩定性。在相同的乳化聚合條件下,POSS 與 CPC 插層劑改質 黏土相較於純的聚苯乙烯具有較低的分子量 (Mn 與 Mw) 與較高的 分子量分佈 (PDI)。CPC 與 POSS 改質之奈米複合材料相較於純的聚 苯乙烯有較高的玻璃轉移溫度。

2.8 參考文獻

[1] Okada A, Kawasumi M, Usuki A, Kojima Y, Kurauchi T, Kamigaito O.

32

Mater Res Soc Symp Proc 1990; 171: 45.

- [2] Okada A, Kawasumi M, Kuraurchi T, Kamigaito O. Polym Prepr 1987; 28: 447.
- [3] Kojima Y, Usuki A, Kawasumi M, Okada A, Kurauchi T, Kamigaito O.J Polym Sci Part A: Polym Chem 1993; 31: 983.
- [4] Usuki A, Kojima Y, Kawasumi M, Okada A, Fukushima T, Kurauchi T, Kamigaito O. J Mater Res 1993; 8: 1179.
- [5] Yano K, Usuki A, Okada A, Kurauchi T, Kamigaito O. J Polym Sci Part A: Polym Chem 1993; 31: 2493.
- [6] Okada A, Usuki A. Mater Sci Eng 1995; 3: 109.
- [7] Lan T, Pinnavaia T. J Chem Mater 1994; 6: 2216.
- [8] Lan T, Pinnavaia T. J Chem Mater 1994; 6: 573.
- [9] Lan T, Kaviratna PD, Pinnavaia T. J Chem Mater 1995; 7: 2144.
- [10]Messersmith P, Giannelis EP. J Polym Sci Part A: Polym Chem 1995;33: 1047.
- [11] Messersmith P, Giannelis EP. Chem Mater 1994; 6: 1719.
- [12]Gilman JW, Jackson CL, Morgan A, Harris R, Manias E, GiannelisEP, Wuthenow M, Hilton D, Phillips SA. Chem Mater 2000; 12: 1866.
- [13]Burnside SD, Giannelis EP. Chem Mater 1995; 7: 1597.
- [14]Tseng CR, Wu JY, Lee HY, Chang FC. Polymer 2001; 42: 10063.
- [15]Tseng CR, Lee HY, Chang FC. J. Polym Sci Part B: Polym Phys 2001; 39: 2097.
- [16] Wu HD, Tseng CR, Chang FC. Macromolecules 2001; 34: 2992.
- [17]Tseng CR, Wu JY, Lee HY, Chang FC. J Appl Polym Sci 2002; 85: 1370.
- [18] Tseng CR, Wu HD, Wu JY, Chang FC. J Appl Polym Sci 2002; 86:

2492.

- [19] Jin Z, Alexander BM, Frank JL, Charles AW. Chem Mater 2001; 13: 3774.
- [20] Wenhua Z, Bruce XF, Seo Y, Eric S, Hsiao B, Patrick TM, Yang NL, Dayi X, Harald A, Miriam R, Jonathan S. Macromolecules 2002; 35: 8029.
- [21]Dongyan W, Jin Z, Qiang Y, Charles AW. Chem Mater 2002; 14: 3837.
- [22]Xie W, Gao Z, Pan W, Hunter D, Vaia RA, Singh A. PMSE Prepr 2000; 82: 284.



Sample	$T_{\rm g}, \ ^{\circ}{\rm C}^{\rm a}$	$T_{0.05}, \ ^{\circ}\mathrm{C}^{\mathrm{t}}$	$T_{0.5}$, °C	Char at 600 \degree C, %
PS	100	390	424	0
CPC/Clay/PS	102	408	424	2.9
POSS/Clay/PS	108	411	446	2.8

表 2-1. 聚苯乙烯奈米複合材料之熱性質分析

^a玻璃轉移溫度 (T_g) , ^b熱重量損失 5% 的裂解溫度 $(T_{0.05})$, ^c熱重量

損失 50% 的裂解溫度(T_{0.5}).



表 2-2. 聚苯乙烯奈米複合材料之分子量與分子量分佈

Sample	$M_{\rm n} (\times 10^3)^{\rm a}$	$M_{\rm w} (\times 10^3)^{\rm b}$	PDI $(M_{\rm w}/M_{\rm n})^{\rm c}$
PS	26.1	31.8	1.22
CPC/Clay/PS	22.5	30.8	1.37
POSS/Clay/PS	21.9	31.1	1.42

^a數目平均分子量(M_n),^b重量平均分子量 (M_w),^c分子量分布(M_w/M_n).



圖示 2-1. 兩種插層劑 POSS 與 CPC 的化學結構.



圖示 2-2. 利用 POSS 插層黏土,並且用乳化聚合製備聚苯乙烯奈米 複合材料.



圖 2-2. 利用 POSS 改質黏土的 X 光繞射圖.



圖 2-3. 兩種插層劑 POSS 與 CPC 改質黏土所製備的聚苯乙烯奈米複合材料之 X 光繞射圖.



圖 2-4. 穿透式電子顯微鏡圖,上圖為 CPC 改質黏土的奈米複合材

料;下圖為POSS 改質黏土的奈米複合材料.



圖 2-5. 純的黏土插層劑改質與插層劑 POSS 改質後黏土的紅外線光

譜圖.



圖 2-6. 聚苯乙烯奈米複合材料的玻璃轉移溫度.



圖 2-7. 熱重量損失曲線(a)純的黏土,(b) POSS 改質黏土,(c)

CPC 改質黏土.



圖 2-8.在氮氣下, 奈米複合材料的熱重量損失曲線(a)純的聚苯乙烯, (b) CPC 改質黏土的奈米複合材料, (c) POSS 改質黏土的奈米 複合材料.